⑲ 日本 国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-194634

Solnt. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❷公開 平成4年(1992)7月14日

G 01 L 5/16 1/18 8803-2F 8803-2F

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全7頁)

69発明の名称

団出 瀬 人

力・モーメント検出装置

ニッタ株式会社

**到特 顧 平2-326987** 

**@出 顧 平2(1990)11月27日** 

@発明者 森本 英夫

奈良県大和郡山市池沢町172 ニッタ株式会社奈良工場内

大阪府大阪市中央区本町1丁目8番12号

個代理人 弁理士 辻本 一義

#### 明 細 書

#### 1. 発明の名称

力・モーメント検出装置

#### 2. 特許請求の範囲

1. 機械的変形により電気抵抗が変化する 4 個の検出業子を直線上に備えた単結晶基板(2)と、中心部と周辺部のいずれか一方を持ている。 部とし、他方を作用部とした起型体(1)が必要子の配対が必要子の配対が設定をは、では、 が必要体(1)の中心線(L1)と一致する。 うに、単結晶基板(2)が起亜体(1)の で、単結晶をで、・モーメント検出装置に於いて、

各検出常子が、同じ電気抵抗値である検出 常子(R。), (R。)をそれぞれ所定の間 隔で直列接続させて成るものとし、起歪体( 1)の中心線(L1)と一致させる線を、前配 検出常子(R。), (R。)間の中央線(L2 )としたことを特徴とする力・モーメント検 出装置。

- 2. 起登体 (1) の中心線 (L1) を、仮想軸 (X) とこれと直交する仮想軸 (Y) とから構成したことを特徴とする確求項1配載の力・モーメント検出装置。
- 3. 検出素子を、ピエゾ抵抗素子により構成したことを特徴とする請求項1又は2記載のカ・モーメント検出装置。

#### 3. 発明の詳細な説明

#### 〔産業上の利用分野〕

この出顧の発明は、ロボットの力覚センサ等と して使用される力・モーメント検出装置に関する ものである。

#### 〔従来の技術〕

従来、この種の検出装置として、半導体の単結 晶基板を利用して力乃至モーメントを検出する装 置が知られており、例えば、第9回及び第10回 に示すようなものがある。

このものは、間図に示すように、機械的変形に より電気抵抗が変化する 4 個の検出素子 (R) ( Rxi, Rxx, Rxx, Rxx, Rx4とする) を直線上に備え た単結晶基板 (2) と、中心部と周辺部のいずれか一方を支持部とし、他方を作用部とした起歪体 (1) とから構成されており、前配検出業子 (R) の配列線が起歪体 (1) の中心線 (L1) と一致するように、単結晶基板 (2) が起歪体 (1) の装面に接着固定してある。

このものでは、上配配金体(1)の作用部に外力(機械的外力)が加わると、第11図の作用示さと、第11図の作用示さと、第11図の技術を表して、の検出面が変形検出書子(R)が変形を発出書子(R)に加われば抵抗値は増加し、圧縮は対力ので、4個の付置を表する。したがあることとなる。 第12図に示すを電子であると、前記抵抗変化(R)をそれぞれ、第12図に示すを電子である。 は、前記抵抗変子(R)をそれぞれ、第12図に示すを電子である。 は、前記抵抗変子(R)をそれぞれ、第12図に示すを電子である。 をそれぞれ、第12図に示すを電子である。 をそれぞれ、第12図に示すを電子であると、前記抵抗変子(R)の電子・メントMェを出力電圧として検出できる。

商、モーメントMx による出力電圧Vuxは、

A R:抵抗值変化量

R : 歪みが加わっていないときの抵抗値

G :ゲージ率

ε : 歪み量

であることから、検出素子Rxiの抵抗値変化量は 亞み量に比例する。即ち、中心線(L1)と直交す る方向のズレに対応して検出素子Rxiの抵抗値は 減少する。このことは他の検出素子Rxi、Rxi、 Rxiについて同じことがいえる。したがって、中 心線(L1)からのズレに対応してモーメントMx による電圧変化 Vxx は小さくなる。

(発明が解決しようとする課題)

そこで、この出願の発明では、検出素子の配列 線と起歪体の中心線とが一致していなくても、モ ーメントの検出特度が極端に低下しない力・モー メント検出器を提供することを課題とする。

(課題を解決する為の手段)

この出職の発明では、機械的変形により電気抵抗が変化する4個の検出素子を直線上に備えた単結晶基板(2)と、中心部と周辺部のいずれか一

 $V_{Hx} = \frac{R_{xx} \cdot R_{xx} - R_{xx} \cdot R_{xx}}{R_{xx} + R_{xx} + R_{xx} + R_{xx}} \times I$ 

となる。(『は電流値を示す)

ところが、上記力・モーメント検出器では、単結晶基板(2)を起歪体(1)の表面に接着固定するに際して、検出素子(R)の配列線と起歪体(1)の中心線(L1)とを完全に一致させることは非常に困難であり、自動・手動にかかわらず、±100 μm 程度の取付け誤差が生じてしまう。この取付け誤差は、モーメントの検出誤差となる。即ち、検出素子Rxxxについて考えると、

検出素子 $R_{xx}$ が起歪体の中心線(L1)上にあれば、検出素子 $R_{xx}$ の歪み量は極大値となるが、検出素子 $R_{xx}$ が中心線(L1)からズレると前配歪み量はズレ量に対応して極大値からはずれることとなる。ここで、

ΔR ----- = G · ε R

方を支持部とし、他方を作用部とした起遊体(1)とから構成されており、前記検出素子の配列線が起逆体(1)の中心線(11)と一致するように、単結晶基板(2)が起遊体(1)の裏面に接着固定された力・モーメント検出装置に於いて、

各検出業子が、同じ電気抵抗値である検出素子(R。), (R。)をそれぞれ所定の間隔で直列接続させて成るものとし、起歪体(1)の中心線(L1)と一致させる線を、前記検出素子(R。), (R。)間の中央線(L2)としている。(作用)

この出願の発明は次の作用を有する。

検出業子(R。)と検出素子(R。)間の中央線(L2)と起歪体(1)の中心線(L1)とがΔェだけ(Δェは検出素子(R。)と検出素子(R。)間の半分の長さよりも小)ずれた場合、遺性に位置された場合と比較して、検出素子(R。)の登はΔε」だけ増加し、検出素子(R。)はΔε」だけ減少する。したがって、検出素子(R。)、(R。)に歪が加わっていないときの抵抗値を

特開平4-194634 (3)

R z とすると、歪が加わったときの R ' z z z R '

$$R' = R_{z} - \Delta R_{z}$$

$$R' = R_{z} - \Delta R_{z}$$

となり、これらは直列接続されていることから全体抵抗は、R'。 + R'。 = 2 R  $_{z}$  + ( $\Delta$ R  $_{z}$  -  $\Delta$ R  $_{z}$  ) となる。

他方、従来の力・モーメント検出器では、検出 素子の配列線が起意体(1)の中心線(L1)から  $\Delta$  x だけずれると、  $\epsilon$  x i は $\Delta$   $\epsilon$  x だけ被少する。 したがって、検出素子(R x )に歪が加わってい ないときの抵抗値をR x とすると、

$$R' = R_1 - \Delta R_2 \ge \alpha \delta$$
.

ここで、  $\Delta$  R 1 与  $\Delta$  R 2 与  $\Delta$  R 2 . R 1 与 R 3 と近似することができるので上記した  $\Delta$  2 だけのズレによる検出素子の抵抗値の変化の比率は、

$$\frac{\Delta R_1 - \Delta R_2}{2 R_3} < \frac{\Delta R_3}{R_1}$$

である.

以下、この発明の要部である力・モーメント検 出器 (D) について詳述する。

上記力・モーメント検出器(D)は、第2図に 示すように、起歪体(1)と、検出素子を備えた 単結晶基板(2)と、前配単結晶基板(2)の全 域を覆うカバー(3)とから構成されている。

起歪体(1)は、第2図に示すように、中央部をダイヤフラム部(11)とした皿状体(10)と、前配ダイヤフラム部(11)の底面中央部から突出させた触部(12)とから構成されており、前配触部(12)に外力が加わると皿状体(10)の上面が前記外力に立て変形せしめられるようにして、この起係(1)に対ったのでは、第3図に示す如く、単結晶基板(2)の配数位置の目安となる、手段の側に記載した中心線(い)と対応する仮想触(X)(Y)及び仮想触(2)を具備させてある。

単結晶基版(2)は、第3因に示すように、半 導体により構成された板状のもので、仮想線(y )に関連して検出素子(R x i )(R x z )(R x z ) このことは、全ての検出素子についても同様のことがいえることから、中央線(L2)と起登体(
1)の中心線(L1)とのズレによる抵抗値の変化は従来のものよりも非常に小さなものとなる。
(実体例)

以下、この出顧の発明の構成を一実施例として 示した図面に従って説明する。

この実施例のものは、第1回に示すない。 (D) では、第1回に示すない。 (D) であるカーメンド((D) で使用したが使用した。 (D) で接続した。 (D) では、 (D) では、 (D) では、 (D) では、 (D) では、 (D) では、 (E) では、

(R<sub>x4</sub>)を、前記仮想線(y)と意交する仮想線 (x)に関連して検出素子(R<sub>y1</sub>)(R<sub>y2</sub>)(R y<sub>3</sub>)(R<sub>y4</sub>)を、それぞれ配設してあり、更には 、前記仮想線(x)と仮想線(y)との間の仮想 線(z)上に検出素子(R<sub>x1</sub>)(R<sub>x2</sub>)(R<sub>x2</sub>) (R<sub>x4</sub>)を配数してある。

上記した検出素子(Rxii)は、同図に示すように、検出素子(Rxii)と検出素子(Rxii)と を一定間隔で面列接続させて構成してあり、仮想線(y)を手段の棚に記載した中央線(L2)としてある。同様に、同図に示す如く、検出素子(Rxzi)を検出素子(Rxzi)と検出素子(Rxzi)を検出素子(Rxzi)と検出素子(Rxzi)と検出素子(Rxzi)と検出素子(Rxzi)と検出素子(Rxzi)と検出素子(Rxzi)と検出素子(Rxzi)と検出素子(Rxzi)と検出素子(Rxzi)から構成させている。

又、上記した検出素子(R vii)は、同図に示す ように、検出素子(R vii )と検出素子(R vii )とを一定間隔で直列接続させて構成してあり、 仮想線(x)を手段の細に配載した中央線(L2)

特周平4-194634 (4)

どしてある。同様に、同図に示す如く、検出素子(Ryz)を検出案子(Ryz)と検出案子(Ryz)と検出案子(Ryz)と検出案子(Ryz)と検出素子(Ryz)と検出素子(Ryz)から、検出素子(Ryz)から、検出素子(Ryz)から構成させている。

即ち、上記検出素子(Rxii 、 Rxii 、 Rxii

上記した単結晶板(2)を起産体(1)に接着固定する際には、仮想軸(X)を仮想線(x)に、仮想軸(Y)を仮想線(y)に、仮想軸(Z)を仮想線(z)に極力一致させるようにして行う

R:とすると、

R' =11=Rz + AR1

 $R'_{xix}=R_x-\Delta R_x$  (第5図参照) となり、これらは直列接続状態にあるから、抵抗 は $R'_{xix}+R'_{xix}=2R_x+(\Delta R_x-\Delta R_x)$ となる。

従来の力・モーメント検出器では、検出業子(Rxi)が仮想軸(Y)からΔxだけズレた場合、 εxiはΔεaだけ被少する。検出業子(Rxi)に 豆が加わっていないときの抵抗値をRiとすると、

R' xi=Ri - AR (第6回参照)

ここで、 $\Delta \times M$ 小さい場合( $\pm 100~\mu$  画 程度であるならば)、 $\Delta R$  、 $\pm \Delta R$  。  $\pm \Delta R$  。 R 、 E 、 E 、 E 、 E を近似することができるので、仮想軸(E )方向に $\Delta \times K$ けずれることによる検出案子の抵抗値の変化の比率は

 $\Delta R_1 - \Delta R_2 \qquad \Delta R_3$ 

R<sub>1</sub> 2 R<sub>2</sub>

が、従来の技術の個にも記載したように、仮想軸 (X)と仮想線(x)間等にズレが生じる。

このズレによる検出誤差は従来の技術の棚のものと比較すると以下の通りである。

①. 仮想線(y)が仮想軸(Y)に一致した場合 (第4回参照)(実際には一致させることは困 難であるが後述①の参考のため記載しておく) 起資体(1)に仮想軸(X)の軸回りモーメン トMェ を加えたときの検出業子(Rェロ)、(R エロンの登は、モエロー モロコニーモーとなる。 ②. 仮想線(y)が仮想軸(Y)に対して仮想軸

#### 7. 仮点級(Y)が仮想軸(Y)に対して仮想軸 <u>(X)の方</u>向にズレている場合

検出素子( $R_{xix}$ )と検出素子( $R_{xix}$ )の間隔を2 d し、検出素子( $R_{xix}$ )、( $R_{xix}$ )が仮想軸(X)方向に $\Delta x$  だけ( $\Delta x$  は d よりも小) ズレると、 $\epsilon_{xix}$  は $\Delta \epsilon_{x}$  だけ増減するので、検出素子( $R_{xix}$ )の抵抗値は $\Delta R_{x}$  増加し、検出素子( $R_{xix}$ )の抵抗値は $\Delta R_{x}$  減少する。検出素子( $R_{xix}$ )。( $R_{xix}$ )に変が加わっていないときの抵抗値を

 $(\Delta x$ が小さい場合 $\Delta R_1 - \Delta R_2 ≒ 0)$ である。

上記のことは、検出素子 (R<sub>xz</sub>), (R<sub>xz</sub>), (R<sub>xz</sub>), (R<sub>xz</sub>) についても同様のことがいえる。

したがって、モーメントMx を検出する為の検出案子Rx が従来技術のものと同量ズレたとしても、ズレによる抵抗値の変化率は従来のものと比較して非常に小さなものとなる。

他方、この実施例のものでは、第7図に示すように、仮想軸(Y)に関連する検出素子( $R_{xx}$ )、( $R_{xx}$ )、( $R_{xx}$ )、( $R_{xx}$ )、相互を電気的にプリッジ接続してあり、又、検出素子( $R_{xx}$ )・・・( $R_{xx}$ )、検出素子( $R_{xx}$ )・・・のいても同様にブリッジ接続してある(図示せず)。

したがって、上記検出素子が従来と同量ズレた 状態で起歪体(1)に配置されたとしても、仮想 軸(X)の軸回りのモーメントMx、仮想軸(Y )の軸回りのモーメントM、と対応する出力電圧 が精度の高いものとなり、その結果、この力・モ

# 特閒平4-194634 (5)

ーメント検出器が使用された第1図に示すロボットハンド(9)の挟持力は設定値に非常に近いものとなる。

向、上記実施例のものにかえて、第8図の如く
、検出素子(Rxii, Rxzi, Rxzi,

#### (発明の効果)

この出職の発明は、上述の如くの構成を有する ものであるから、次の効果を有する。

この発明のものでは、中央線(L2)と起亞体( 1)の中心線(L1)とのズレによる抵抗値の変化 は従来のものよりも非常に小さなものとなるから 、モーメントの検出精度が極端に低下しない力・ モーメント検出器を提供できることとなる。

### 4. 図面の簡単な説明

第1図はこの発明の検出器を使用したロボット ハンドの説明図、第2図はこの発明の力・モーメ ント検出器の断面図、第3図は前記検出器の起登 体と単結晶基板の説明図、第4 図~第6 図は前記 検出器の作用の説明図、第7 図は前記検出器の検 出素子相互のブリッジ回路の説明図、第8 図は他 の実施例の説明図、第9 図~第12 図は従来の技 術の説明図であり、図中、

(11) …中心線

(12) …中央線

(R。) …検出素子

(R.) … 検出素子

(X) … 仮想軸

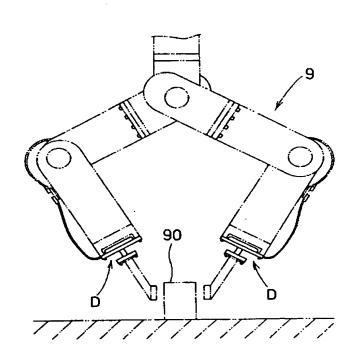
(Y) 仮想軸

(1) …起歪体

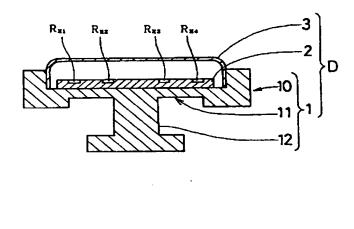
(2) …单結晶基板

代理人 弁理士 辻 本 一 義

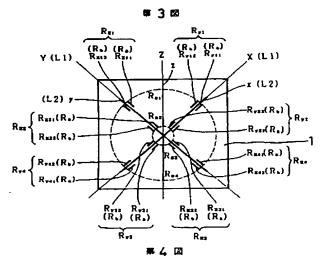
野 1 図

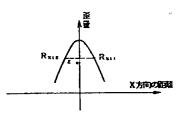


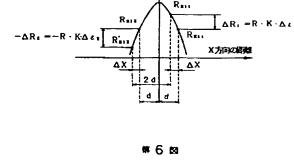
第 2 図



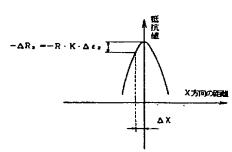
### 特開平4-194634 (6)



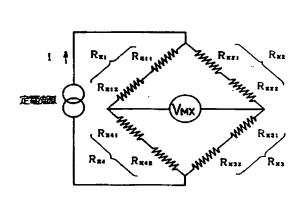


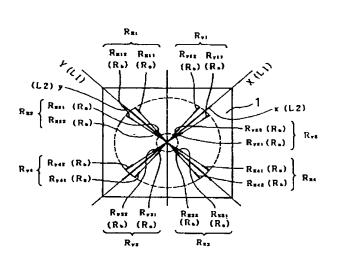


# 5 B



**第7**図

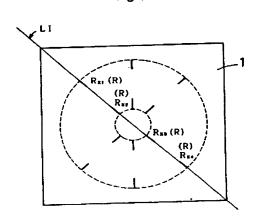


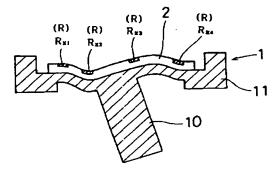


#8 ⊠

# 特別平4-194634(7)

**₽9**⊠





第11図

第12 図

